



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16517—1996  
idt IEC 1178-3:1993  
QC 680200

---

## 石英晶体元件 电子元器件 质量评定体系规范 第3部分：分规范 鉴定批准

Quartz crystal units—A specification in the Quality Assessment

System for Electronic Components

Part3: Sectional specification—Qualification approval

---

1996-09-09发布

1997-05-01实施

国家技术监督局 发布

## 目 次

前言 .....	III
IEC 前言 .....	IV
1 总则 .....	1
1.1 范围 .....	1
1.2 引用标准 .....	1
2 优先额定值和详细规范制定导则 .....	1
2.1 优先额定值和特性 .....	1
2.2 详细规范应给出的内容 .....	1
3 质量评定程序 .....	2
3.1 鉴定批准的条件 .....	2
3.2 结构类似 .....	2
3.3 证明合格的试验记录 .....	2
3.4 鉴定批准 .....	2
3.5 质量一致性检验 .....	4

## 前　　言

本标准等同采用 IEC 1178-3:1993《石英晶体元件——IECQ 规范 第 3 部分：分规范——鉴定批准》。

本标准的上层标准是 GB/T 12273—1996《石英晶体元件电子元器件质量评定体系规范 第 1 部分：总规范》。

这样，使我国石英晶体元件国家标准与 IEC 电子元器件质量评定体系中标准相一致，以适应此领域中国际技术交流和经济贸易往来迅速发展的需要，便于我国生产的这类产品进行质量认证并进入国际市场。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国营华星无线电器材厂。

本标准主要起草人：管兴明、孙建华。

## IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)是由各国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成的世界性标准化组织。IEC 的目的是促进电工电子领域标准化问题的国际合作。为此目的,除其他活动外,IEC 发布国际标准。国际标准的制定由技术委员会承担,对所涉及内容关切的任何 IEC 国家委员会均可参加国际标准的制定工作。与 IEC 有联系的任何国际、政府和非官方组织也可以参加国际标准的制定。IEC 与国际标准化组织(ISO)根据两组织间协商确定的条件保持密切的合作关系。

2) IEC 在技术问题上的正式决议或协议是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

3) 这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式发布,以推荐的形式供国际上使用,并在此意义上,为各国家委员会认可。

4) 为了促进国际上的统一,各 IEC 国家委员会有责任使其国家和地区标准尽可能采用 IEC 标准。IEC 标准与相应国家或地区标准之间的任何差异均应在国家或地区标准中指明。

国际标准 IEC 1178-3 是由 IEC 第 49 技术委员会(频率控制和选择用压电与介电器件)制定的。

本标准的部分技术内容依据 IEC 122-1 制定。

本标准构成 IECQ 石英晶体元件规范 第 3 部分:分规范——鉴定批准。

IEC 1178-1 构成总规范。

IEC 1178-2 构成分规范:能力批准。

IEC 1178-2-1 构成空白详细规范:能力批准。

IEC 1178-3-1 构成空白详细规范:鉴定批准。

本标准文本以下列文件为依据:

国际标准草案	表决报告
49(CO)229	49(CO)243

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

本标准封面上的 QC 号是 IECQ 规范号。

# 中华人民共和国国家标准

## 石英晶体元件 电子元器件 质量评定体系规范

### 第3部分:分规范 鉴定批准

GB/T 16517—1996  
idt IEC 1178-3:1993  
QC 680200

Quartz crystal units—A specification in the Quality Assessment  
System for Electronic Components  
Part3: Sectional specification— Qualification approval

## 1 总则

### 1.1 范围

本标准适用于以鉴定批准为基础的石英晶体元件的质量评定。

本标准规定了总规范 GB/T 12273—1996(idt IEC 1178-1:1993)中给定的优先额定值和特性以及适用的试验方法和测量方法,并给出了石英晶体元件详细规范中采用的一般性能要求。

### 1.2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

IEC 和 ISO 成员国保存有现行有效国际标准目录。

GB/T 12273—1996 石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第1部分:总规范(idt IEC 1178-1;1993)

SJ/T 10708—1996 石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第3部分:空白详细规范  
鉴定批准(idt IEC 1178-3-1:1993)

IEC 68 环境试验\*)

IEC QC 001002(1986) IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)程序规则

## 2 优先额定值和详细规范制定导则

### 2.1 优先额定值和特性

详细规范中给出的值应优先从 GB/T 12273—1996 的 2.3 中选取。

### 2.2 详细规范应给出的内容

详细规范的制定要求在 SJ/T 10708 空白详细规范中给出。

每一个详细规范应规定检查要求的所有试验和测量,至少应包括空白详细规范给出的有关试验及其方法和严酷度。

单一的详细规范应仅包括一种盒型,但可以包括不同的引出端结构。

下列内容应在每个详细规范中给出。

\*) 采用 GB/T 12273—1996 中引用时注明的版本和所用的条款号。